北京同步辐射装置 4B7B 软 X 射线标定束线的 性能研究及应用

易荣清¹ 赵屹东² 王秋平³ 郑 雷² 杨家敏¹ 何小安¹ 李朝光¹ 江少恩¹ 丁永坤¹ 崔明启²

(2中国科学院高能物理研究所,北京100049;3中国科技大学国家同步辐射实验室,安徽合肥 230029)

摘要 描述了在北京同步辐射装置(BSRF)4B7B软X射线上,通过多种方法进行高次谐波抑制,采用复合滤片消除高能区低能X射线等性能改进方法使光源的高次谐波含量小于1%、能量分辨优于3000,无杂散光。在4B7B光束线上开展了X射线探测器(XRD)灵敏度、平面镜反射率和滤片透射率的标定方法研究,XRD灵敏度标定不确定度优于3%,平面镜反射率标定不确定度小于3.5%,滤片透射率标定不确定度优于1%。

关键词 X射线光学;同步辐射;标定;不确定度

中图分类号 TN247; O536 文献标识码 A doi: 10.3788/AOS201434.1034002

Characteristic Study and Application of the Soft X-Ray Beam Line 4B7B on BSRF

Yi Rongqing¹ Zhao Yidong² Wang Qiuping³ Zheng Lei² Yang Jiamin¹ He Xiaoan¹ Li Chaoguang¹ Jiang Shaoen¹ Ding Yongkun¹ Cui Mingqi²

¹ Research Center of Laser Fusion, China Academy of engineering Physics, Mianyang, Sichuan 621900, China
² Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

³ National Synchrotron Radiation Laboratory, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui 230029, China

Abstract This subject improves light source capability of the soft X-ray beam line 4B7B on the Beijing synchrotron radiation facility (BSRF) by restraining the low energy X-ray in high energy range and the higher-harmonics wave in every energy point. This light source has harmonics wave less than 1%, energy resolution of more than 3000. Some researches on calibration of X-ray detector (XRD) sensitivity, mirror reflectivity, filter transmittance on the soft X-ray beam line 4B7B are performed. The results show that the uncertainty of XRD sensitivity is less than 3%, the uncertainty of mirror reflectivity is less than 3.5%, and the uncertainty of filter transmittance is less than 1%. **Key words** X-ray optics; synchronous radiation; calibration; uncertainty **OCIS codes** 340.7480; 340.6720; 350.5400; 350.2770

1 引 言

在惯性约束聚变(激光、Z-Pinch)和其他高能量 密度物理实验研究中,X射线辐射的精密测量是核心 内容之一,目前的实验诊断约 60%与 X射线测量相 关^[1-5]。为了达到校验相关数值模拟程序的目的,需 要不断地提高实验数据的精度。精密标定是实验精 密化的重要基础,而同步辐射光源为 X射线探测元件 的精密标定提供了一种可能的条件。另外,由于每一 发靶的制靶和打靶都需要高额费用,尤其是神光 III 主机实验,因而要求实验诊断设备每一发都能够给出 精确的实验数据,提高每一发打靶的利用率。自 20 世纪 80 年代末至今,美国、德国、俄罗斯及日本等国 均在各自的同步辐射装置^[6]上,建造了专门用于软 X 射线探测器性能研究的光束线^[7-10],美国东、西部共 建了 7 条专用束线,可见其重要性。

要实现 X 射线探测系统的精密标定需要满足 三个条件:1)要有一台好的光源,即强度高,能区宽 且连续可调,能量分辨高、高次谐波少,光斑均匀等; 2)需要一个可以溯源的 X 射线强度测量标准;3)需 要一台好的标定装置,标定方法是需要通过标定装

作者简介:易荣清(1964—),男,研究员,主要从事激光等离子体诊断和X射线计量学等方面的研究。

收稿日期: 2014-05-05; 收到修改稿日期: 2014-06-25

置来实现的。过去在这三个方面都存在一定的不 足。在光源方面,受碳沾污、光栅效率和经费的影 响,光源强度低(10⁸ counts/s)、能量分辨差(100)、 高次谐波严重(50%)。在测量标准方面,引进的是 美国标准计量局的标准,不确定度为17%。在标定 方法方面,采用束流归一,存在较大的不确定度。所 以,测量精度一直不高。

本文在北京同步辐射装置(BSRF)上首次采用固定/可变包含角变间距光栅单色器结构,配套深刻槽 光栅、高次谐波抑制镜等创新技术,建立了 4B7B 软 X 射线标定束线,有效地解决了 X 射线光源高能量分辨 本领、高光谱纯度和宽能谱扫描范围的难题,满足了 不同用户(探测器标定和光谱学研究)对光源的需求。

2 软 X 射线束线的结构

软 X 射线标定束线建设有两个物理目标:1)满

足惯性约束聚变(ICF)实验精密标定需要;2)满足 光谱学研究的需要。精密标定要求能量范围大 (50~1500 eV),光源强度大于 10° counts/s,能量 分辨大于 100,高次谐波小于 1%,无杂散光。光谱 学研究要求能量分辨高(大于 3000),光斑小。所以 需要解决能量分辨高与光谱范围宽之间的矛盾和高 次谐波抑制的难题。为了解决高能量分辨与宽光谱 范围之间的矛盾,采用了固定/可变包含角变间距光 栅单色器扫描结构。光路结构如图 1 所示,整个光 束线全长 30 m,由前置聚焦镜(TM1)、人射狭缝 (slit 1)、球面镜(SM)、平面镜(PM)、变线距平面 光栅(VSPG)、出射狭缝(slit 2)和后聚焦镜(TM2) 构成。这种结构的特点是可以运行在两种工作模式 下:在高分辨模式下,采用固定包含角进行细扫;在 宽谱模式下,采用变包含角扫描。





3 软 X 射线束线的性能研究

3.1 高次谐波的抑制

影响光源品质和标定精度的一个重要因素就是 光源中含有高次谐波,而高次谐波是衍射元件的产



图 2 深刻槽光栅的衍射效率曲线

Fig. 2 Diffraction efficiency curves of profundity slot grating

物之一,要抑制高次谐波是一件非常困难的系统性 工作。采用了三个方法共同进行高次谐波的抑制。

3.1.1 采用深刻槽的反射光栅

光源采用深刻槽的 Laminar 反射光栅^[11-12],线空比为 1:1,刻槽深为 50 nm,中心线密度为 1500 line/mm。 通过 PC Grate-4E(X 射线与级紫外)通用光束线设计程 序模拟计算,给出如图 2 所示的结果,从图中可以看出, 光栅的二级衍射比一级衍射低 2 个量级。

3.1.2 采用变包含角的单色器结构

变包含角的单色器结构由平面镜和反射光栅组成,如图 3 所示,在某一能段,固定平面镜的角度,可以抑制一段能区的高次谐波,通过改变光栅的角度获得不同能量的单色光,这种方法对光栅的效率有一定影响,但是可以有效抑制高次谐波,通过理论计算得出对二次谐波的抑制能力为 4 倍,3 次谐波的抑制能力超过 8 倍。



图 3 变包含角的单色器结构

Fig. 3 Homochromy system structure of varied contain angle

3.1.3 采用谐波抑制镜与滤片的组合

对于低于 150 eV 能段的高次谐波,采用上述两 种方法是不能完全抑制高次谐波的,选择采用谐波 抑制镜与滤片的组合,原理如图 4 所示,在不同的能 区选择不同角度、不同材料的平面镜配相应材料和 厚度的滤片来实现高次谐波的抑制。

3.2 高次谐波的测量

在北京同步辐射 4B7A 光束线上,利用透射光 栅谱仪对不同情况下高次谐波的含量进行精密测量,实验设置如图 5 所示。

在没有使用外部高次谐波抑制的条件下,利用 透射光栅谱仪对不同能量的光子进行测量,测量光 谱结果如图 6 所示。从实验结果可以知道,采用深 刻槽光栅,在大于 750 eV 的能区,高次谐波可以忽 略不计,在低于 750 eV 的能区,高次谐波仍然对标



- 图 4 采用谐波抑制镜与滤片的组合抑制高次谐波的 原理示意图
- Fig. 4 Diagram of higher-harmonics wave suppressor and filter



图 5 实验设置

Fig. 5 Experimental setup







为了进一步提高标定精度,在低于 750 eV 的能 区需要采取高次谐波抑制镜和滤片等手段进行谐波 抑制。图 7 给出了利用谐波镜在 100 eV 能区测量 的透射光栅谱,通过比较,可以看出谐波的抑制是有 效的。通过数据处理给出了采用三种方法共同进行 谐波抑制的结果如图 6 所示,从图中可以看出,除 450 eV 能点外,其余能区的谐波均小于 1%。

3.3 高能区低能 X 射线抑制

在 Al 阴极 X 射线探测器(XRD)灵敏度的标定 过程中,给出如图 8(a)所示的实验结果,从图中可 以看出,在大于 850 eV 的能区标定结果不正确,说 明光源中含有杂散光,在光路中设置了一个厚度为 0.2 μm的 Al 滤片,结果有明显好转,通过滤片的透 射率分析,说明光源中的杂散光是低能光。加一层 滤片后标定结果仍然没有达到实验要求,说明杂散 光是一个连续的低能 X 射线,所加的 Al 滤片在 L 边 有较大的透射率的原因是在高能区平面镜和光栅都 是小角度入射,低能 X 射线全反射角小。为了解决这 个问题,又增加一个1μm的碳滤片组成复合滤片,利 用复合滤片相互吸收的原理,达到消除低能连续 X 射 线的目的。实验结果如图 8(b)所示,实验结果说明 采用复合滤片有效消除了高能区低能 X 射线。



图 7 在 100 eV 能区的谐波抑制

Fig. 7 Harmonics wave suppression at 100 eV energy area



图 8 (a)无,(b)有复合滤片时 XRD 灵敏度标定结果 Fig. 8 Calibrated result of XRD sensitivity (a) without, (b) with complex filter



图 9 光源的强度谱 Fig. 9 Spectrum intensity of the light source

3.4 光源的强度改善和测量

影响光源强度的因素主要是储存环的束流和光路光学元件的碳沾污。通过臭氧氧化清除光路上的碳,光源强度有明显的改善。利用 AXUV-100G 标准探测器,测量出光源的谱强度,测量结果如图 9 所示,从测量结果可以看出,光源强度大于10⁹ counts/s,与清除之前相比提高了一个量级。

3.5 光源的能量分辨测量

光源的能量分辨是衡量光源好坏的重要指标之一,直接影响探测元件的标定精度。通过测量 Ar 气吸收边附近的精细结构,能够解读光源的能量分 辨。测量结果如图 10 所示,给出了极限能量分辨率 的测量结果,结果为 Ar 的 L 边 2p3/2→3d5/2 跃迁 共振峰的实测结果,其本征宽度为 114 meV,拟合出 仪器展宽约 37 meV,此处能量分辨率大于 6000,远 远超出当初 3000 的设计水平。





4 软 X 射线束线的应用

4.1 XRD 灵敏度标定

XRD 是辐射温度测量系统最重要的元件之一^[10],利用该元件将激光打靶产生的 X 射线信号转换成电信号,用示波器记录下来,然后通过测量到的电信号和探测器的灵敏度反映 X 射线的强度。所以探测器的灵敏度标定不确定度直接影响辐射温度的测量精度。

在 4B7B 软 X 射线标定束线上,利用德国联邦 物理技术研究院(PTB)引进的 X 射线强度测量标 准:探测器型号为 AXUV-100,不确定度小于 2%, 开展了 Al 阴极 XRD 灵敏度的标定方法研究,灵敏 度的标定结果如图 11 所示,可以看出,除了 Al 阴极 材料的 k 边外,还存在 C 的 k 边和 O 的 k 边,说明



图 11 Al 阴极 XRD 灵敏度标定曲线 Fig. 11 Sensitivity curve of XRD(Al)

XRD 的光阴极可能存在沾污和氧化。从标定结果 来看,两次标定结果完全重合,两段能区标定结果自 洽,说明标定结果可靠。



图 12 Fe 滤片透射率标定曲线

Fig. 12 Transmittance curve of Fe filter

影响 XRD 探测器灵敏度标定的主要因素有三 个方面:光源、测量标准和标定方法。在光源方面主 要有光源的稳定性、能量分辨、高次谐波和杂散光 等,测量标准方面主要有标准的不确定度和光源强 度的测量不确定度等,在标定方法方面主要有测量 系统的不确定度和信噪比等,通过不确定度评估, XRD 灵敏度标定的不确定度优于 3%。

4.2 滤片透射率标定

滤片也是辐射温度测量系统的重要元件之一^[10],利用滤片的吸收和透过特性进行 X 射线谱选通,其透射率直接影响透过滤片的 X 射线的绝对量,从而影响辐射温度的测量精度。在 4B7B 软 X 射线标定束线上,利用 AXUV-100 硅光二极管和 6517A 弱电流计分别测量 X 射线的信号和通过滤 片后的 X 射线信号,通过比较给出不同能点滤片的 透射率。实验结果如图 12 所示,图中是 Fe 滤片实 验测量结果与利用 Henke 吸收系数计算结果的比较。从图中看出两者一致性非常好,说明标定结果 是可靠的。

滤片透射率标定是相对标定,影响滤片透射率 标定结果的因素主要有滤片的均匀性和沙眼、光斑 均匀性、光源单色性(能量分辨)、光源的高次谐波、 杂散光、探测器的动态范围和信噪比等。通过抑制 光源的高次谐波、消除杂散光、提高光源的单色性、 减小光斑尺寸等措施,透射率的标定精度有明显提 高。通过不确定度评估,透射率的标定不确定度好 于1%。

4.3 平面镜反射率标定

平面镜也是辐射温度测量系统的重要元件之

一^[10],利用平面镜的反射率随光子能量的增加而降低的原理抑制 X 射线谱中的高能成分,与滤片组合实现选通。因此,平面镜的反射率直接影响辐射温度的测量精度。在 4B7B 软 X 射线标定束线上,利用两个 AXUV-100 硅光二极管和 6517A 弱电流计,其中 1 # 探测器设置在平面镜的前端,2 # 探测器设置在平面镜的后端,固定平面镜的角度。利用 1 # 探测器测量光源的强度,利用 2 # 探测器测量经过平面镜反射后的光强,通过比较法给出不同能点平面镜的反射率。实验结果如图 13 所示,从图中可以看出,使用时间比较长的平面镜,反射率发生较大变化,主要原因是沾污,通过模拟计算说明,沾污杂质主要是碳,来源于实验环境中的油蒸气,采用射频 辉光放电清洗非常有效,如图 13 所示。



图 13 平面镜反射率标定结果

Fig. 13 Calibration result of mirror reflectivity

平面镜的反射率是相对标定,影响平面镜反射率 标定结果的因素主要有平面镜的角度、光源单色性 (能量分辨)、光源的高次谐波、杂散光、探测器的动态 范围和信噪比等。采用固定平面镜的角度、抑制光源 的高次谐波、消除杂散光、提高光源的单色性等措施 后,反射率的标定精度有明显提高。通过不确定度评 估,平面镜反射率的标定不确定度优于3.5%。

5 结 论

在北京同步辐射装置上,采用固定/可变包含角 变间距光栅单色器结构,建立了 4B7B 光束线,开展 了光束线的性能研究,采用三种方法进行高次谐波 的抑制,利用复合滤片消除了杂散光,光源的技术指 标达到国际同等先进水平。利用 4B7B 光束线,开 展了 X 射线探测器件的精密标定技术研究,取得重 要进展,XRD 探测器的灵敏度、滤片透射率和平面 镜反射率标定精度分别达到 3%、1%和3.5%,将这 些结果应用到神光 III 原型物理实验中,辐射温度 的测量不确定度从原来的8%降低到3%。

参考文献

- Sun Kexu, Yang Jianguo, Zheng Zhijian. The sub-keV X-ray spectrometer used in laser plasma interaction experiments [J]. High Power Laser and Particle Beams, 1990, 2(1): 16-22. 孙可煦,杨建国,郑志坚. 用于激光等离子体诊断的亚千 X 射线 能谱仪[J]. 强激光与粒子束, 1990, 2(1): 16-22.
- 2 Yi Rongqing, Miao Wenyong, Sun Kexu, *et al.*. Experimental investigation of radiation temperature in hohlraum [J]. Acta Physica Sinica, 1996, 45(2): 443-448. 易荣清, 缪文勇, 孙可煦, 等. 腔内辐射温度的实验研究[J]. 物
- 理学报,1996,45(2):443-448.
- 3 Yi Rongqing, Li Shanwei, Sun Kexu, *et al.*. M-shell X-ray emission from 0.35 μm laser produced gold plasma [J]. Journal of Atomic and Molecular Physics, 1997, 14(1): 20-22. 易荣清,李三伟,孙可煦,等. 0.35 μm 激光辐照金盘靶产生的 M 壳层 X 射线辐射研究[J]. 原子分子物理学报, 1997, 14(1): 20-22.
- 4 Yi Rongqing, Yang Guohong, Cui Yanli, *et al.*. Study of X-ray detector system characteristics on the 3B3 medium energy beamline in BSRF [J]. Acta Physica Sinica, 2006, 55 (12): 6287-6291.

易荣清,杨国洪,崔延莉,等.北京同步辐射 3B3 中能束线 X 射 线探测系统性能研究[J].物理学报,2006,55(12):6287-6291.

- 5 Yi Rongqing, Li Shanwei, Jiang Shaoen, *et al.*. Measurement technique of radiation temperature with tigh time-resolution [J]. High Power Laser and Particle Beams, 2008, 20(6): 965-969. 易荣清,李三伟,江少恩,等. 高时间分辨辐射温度测量技术 [J]. 强激光与粒子束, 2008, 20(6): 965-969.
- 6 Lin Weihao, Luo Hongxin, Song Li, *et al.*. Absolute flatness measurement of optical elements in synchrotron radiation [J]. Acta Optica Sinica, 2012, 32(9): 0912005.
 林维豪,罗红心,宋 丽,等. 同步辐射用光学元件面形绝对检测方法的研究[J]. 光学学报, 2012, 32(9): 0912005.
- 7 K M Campbell, F A Weber, E L Dewald, *et al.*. Omega dante soft X-ray power diagnostic component calibration at the national synchrotron light source [J]. Rev Sci Instrum, 2004, 75(10): 3768-3771.
- 8 E L Dewald, K M Campbell, R E Turner, et al.. Dante soft Xray power diagnostic for national ignition facility [J]. Rev Sci Instrum, 2004, 75(10): 3759-3761.
- 9 R H Day, P Lee, E B Saloman, *et al.*. Photoelectric quantum efficiencies and filter window absorption coefficients from 20 eV to 10 keV [J]. J Appl Phys, 1981, 52(11): 6965-6974.
- 10 Li Sanwei, Song Tianming, Yi Rongqing, *et al.*. Quantitative study of radiation temperature for gold hohlraum on SG-II laser facility [J]. Acta Physica Sinica, 2011, 60(5): 055207.
 李三伟,宋天明,易荣清,等.神光II 激光装置黑腔辐射温度定 量研究 [J]. 物理学报, 2011, 60(5): 055207.
- 11 Wang Xiaojing. Retro diffraction properties of reflecting grating with right angle grooves [J]. Acta Optica Sinica, 1989, 9(8): 732-740.

王效敬. 直角刻槽反射光栅的后向衍射特性[J]. 光学学报, 1989, 9(8): 732-740.

12 Chen Xiao, Yan Binbin, Song Feijun, *et al.*. Diffractive properties of DMD gratings and its new application in tunable fiber lasers [J]. Acta Optica Sinica, 2012, 32(7): 0705003.
陈 笑,颜玢玢,宋菲君,等. DMD 光栅的衍射特性及其在可调 谐激光中的应用[J].光学学报, 2012, 32(7): 0705003.